



Beiblatt 1 - REM Neon40

Zur Nutzerordnung der Abteilung für Elektronenmikroskopie des
Departments für Chemie, Universität zu Köln

Geräteart: Rasterelektronenmikroskop – REM
und ‚focused ion beam workstation‘ - FIB

Gerätename: Neon40 CrossBeam

Hersteller: Zeiss

Anschaffung: 2008

Standort: Department für Chemie, Hörsaaltrakt,
Untergeschoss, Raum HS021

Spezifikationen:

- field emission gun (FEG)
- Probenbearbeitung durch ‚focused ion beam‘ - FIB
- Gasinjektionssystem (GIS)
- Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS/EDX)
- STEM-Detektor
- Elektronen- und Ionenstrahlolithographie

Nutzungskosten:

Nutzer aus dem Dept. Chemie: 70 € pro Stunde

Universitäre Nutzer außerhalb des Dept. Chemie: 100 € pro Stunde

Externe Nutzer aus Industrie und Wirtschaft: nach Absprache mit dem
Plattformleiter (s. Signatur)

Department Chemie
Zentrale Analytik
Elektronenmikroskopie

Dr. Stefan Roitsch
Tel.: +49 221 470-4546
E-Mail: sroitsch@uni-koeln.de

